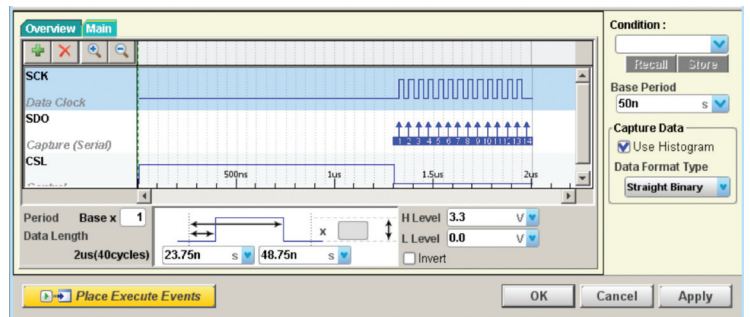
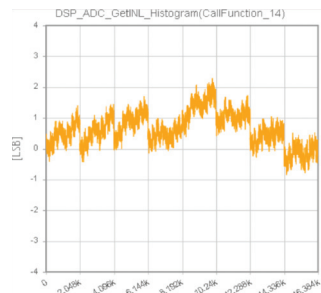
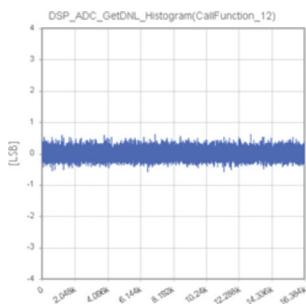
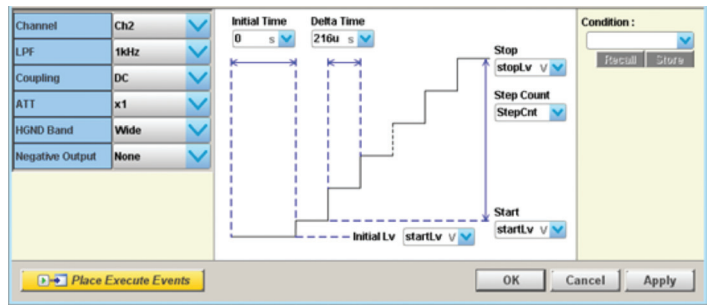
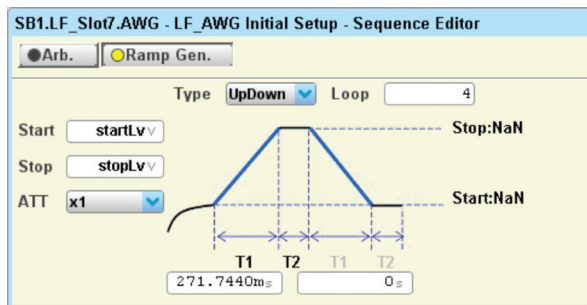


ADC Linearity Test Solution

計測システム EVA100



ADC・リニアリティ試験を簡単に・高精度に

測定に必要な機能やソフトウェアを内蔵

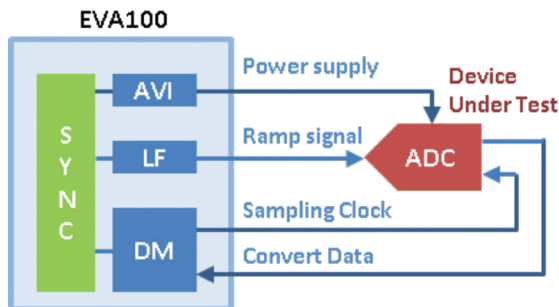
直観的に操作できる各種アプリケーションツール

高精度・高速計測ソリューション

■ EVA100によるADCリニアリティ試験

EVA100はADCのリニアリティ特性を測定するために必要な計測モジュールをコンパクトな筐体内に実装しています。最適化されたアプリケーションツールにより、簡単かつ高精度な試験結果を得ることが出来ます。

EVA100 リニアリティ測定構成

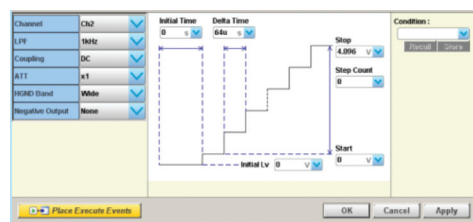


- AVI: 電圧電流源・モニタモジュール
- LF: 17-bit精度直線ランプ出力、AWGモジュール
- DM: デジタルモジュール、ヒストグラム処理

■ 同期測定制御

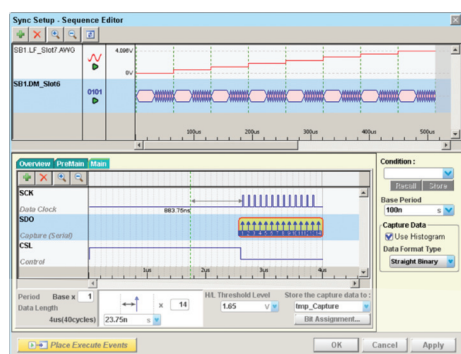
- 直感的なGUIで各信号の測定タイミングを簡単に設定可能
- ハードウェア同期による高精度なタイミング設定で高い測定再現性を実現

ステップ・ランプ波形設定



- 設定項目
- ・スタート電圧
 - ・ストップ電圧
 - ・ステップ電圧
 - ・タイムインターバル

AD変換タイミングと出力データ取り込み設定

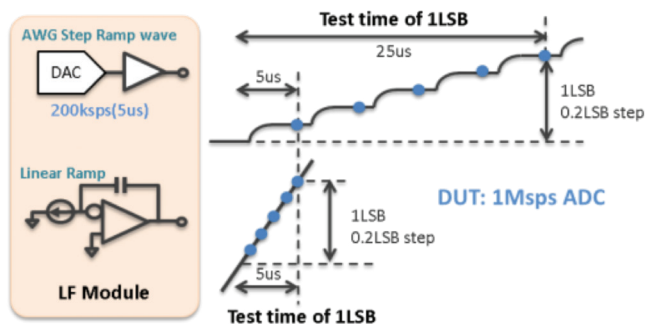


- ステップ・ランプ波形とAD変換のタイミングをGUI上に表示。同期設定を容易に確認できます。
- AD変換とデータ取り込みの設定はタイミングチャート方式で設定します。

■ 17-bit精度直線ランプによる高速高精度試験

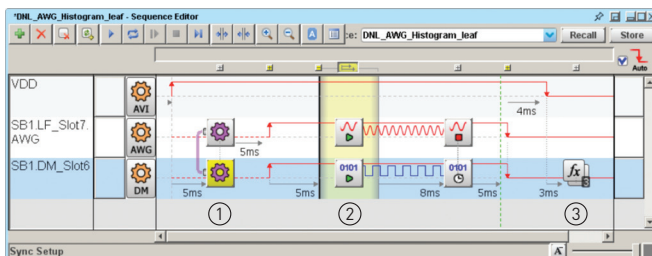
直線ランプ方式による高速測定にも対応しています。ADCのサンプリングが高速であるほど、テストタイムの削減に効果を発揮します。

- 17-bit精度の直線ランプ信号出力
- 14-bitADCを高速に試験可能

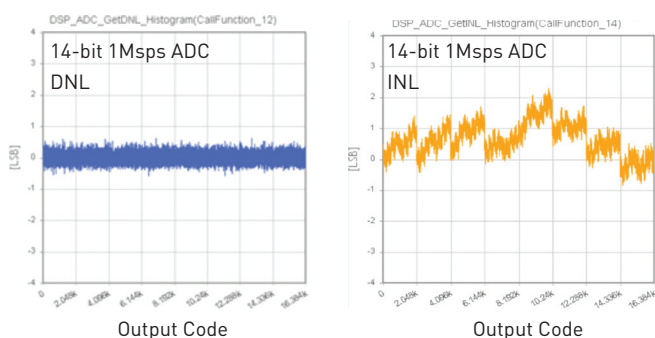


■ テストシーケンスの標準テンプレートを搭載

標準テンプレートに登録されているテストシーケンスを変更することで、よりスピーディーに試験環境を構築できます。



レポート出力機能による特性グラフ出力



■ 仕様

- ステップ・ランプ信号リニアリティ 15-bit (typ)
- 直線ランプ信号リニアリティ 17-bit (typ)
- 直線ランプ発生周期 500μs ~ 500ms
- ヒストグラム演算 高速ハードウェア処理

ADVANTEST®

株式会社アドバンテスト

www.advantest.com

EVAプロジェクト E-mail:info_eva@advantest.com